PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwaits 03SGL 0180WOP	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über d Recherchenberichts (F zutreffend, nachstehen	ormblatt PCT/IS	
Internationales Aktenzeichen	internationales Anmeld (Tag/Monat/Jahr)	ledatum	(Frühestes) Pri	ioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 03/03907	15/04/20	003	15	6/04/2002
Anmelder SCHOTT GLAS				
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	de von der Internationale:	n Recherchenbehörde e	rstellt und wird d	dem Anmelder gemäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ternationalen Büro überm	ittelt.		
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew		Blätter. esem Bericht genannten	 Unterlagen zum	n Stand der Technik bel.
1. Grundlage des Berichts				
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inter durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf gereicht wurde, sofern unf	i der Grundlage der inter ter diesem Punkt nichts	rnationalen Anm anderes angege	eldung in der Sprache ben ist.
Anmeidung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.			rsetzung der internationalen
 b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S 	n Anmeldung offenbarter Sequenzprotokolls durchc	n Nucleotid- und/oder	Aminosāuresed	quenz ist die internationale
in der internationalen Anmel				
zusammen mit der internation	onaien Anmeldung in com	nputeriesbarer Form ein	gereicht worden	ist.
bei der Behörde nachträglich			*	
bei der Behörde nachträglich	h in computeriesbarer Fo	rm eingereicht worden i:	st.	
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte sch im Anmeldezeitpunkt hina	riftliche Sequenzprotoko	oil nicht über den t.	n Offenbarungsgehalt der
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputeriesbarer Form erfa	aßten Informationen den	n schriftlichen Se	equenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	ben sich als nicht reche	rchierbar erwiesen (sie	ehe Feld i).	•
3. Mangelnde Einheitlichkeit	•	•		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	idung			
X wird der vom Anmelder eing	jereichte Wortlaut genehr	nigt.		•
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festges	etzt:		
				•
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				· · ·
wird der vom Anmelder einge wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	egel 38.2b) in der in Feld i e innerhalb eines Monats i	ii angegebenen Fassun	g von der Behör sendung dieses	de festgesetzt. Der internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	Abb. Nr. <u>6</u>	
wie vom Anmelder vorgesch	ılagen			keine der Abb.
X well der Anmeider selbst keir	ne Abbiidung vorgeschlar	gen hat.	_	
well diese Abbildung die Erfil	indung besser kennzelchr	net.		
	•			



nternationales Aktenzeichen

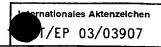
PCT/EP 03/03907

Feld III

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von Substraten (202,212) mit elektrischen, halbleitenden, mechanischen und/oder optischen Bauelementen sowie ein Verbundelement. Das Verfahren soll hinsichtlich der zu verbindenden Substrate im Wesentlichen materialunabhängig und insbesondere auch für empfindliche Substrate geeignet sein, dabei eine hohe chemische und physikalische Stabilität aufweisen und/oder eine hermetische Kavität erzeugen. Erfindungsgemäss wird ein erhabener Rahmen (210a,210b,210c,210d), insbesondere aus anodisch bondbarem Glas auf eines der beiden Substrate aufgedampft, um als Verbindungselement zu dienen.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/50 H01L23/10 B81B7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L B81B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der i	in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
	EP 0 280 905 A (HITACHI LTD) 7. September 1988 (1988-09-07)	1-4,7, 10-15, 17-22, 25,26, 28-34, 36,37, 39-41
	Spalte 4, Zeile 47 - Zeile 58 Spalte 5, Zeile 45 - Zeile 49 Spalte 7, Zeile 7 - Zeile 15	
	-/	
	*	
		*

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26/08/2003

19. August 2003

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016

Ahlstedt, M

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

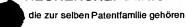
/EP 03/03907

	Ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
x	US 5 895 233 A (STRATTON THOMAS G ET AL) 20. April 1999 (1999-04-20) Spalte 2, Zeile 50 - Zeile 62	1-5,7, 9-15, 18-23, 25, 27-34, 37-39	
	Spalte 3, Zeile 22 - Zeile 32 Spalte 4, Zeile 53 - Zeile 57		
	WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low-temperature and low-voltage using evaporated glass", VACUUM MICROELECTRONICS CONFERENCE, 1996. IVMC'96., 9TH INTERNATIONAL ST. PETERSBURG, RUSSIA 7-12 JULY 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, PAGE(S) 427-430 XP010232226 ISBN: 0-7803-3594-5 das ganze Dokument	1-3,7, 10,11, 19-21, 25,28, 29,37	
ŀ			
ŀ			
		ļ	
1			

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich



Internationales Aktenzeichen

1/EP 03/03907

an	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	EP 0280905	A	07-09-1988	JP JP DE DE EP KR US	2102016 C 8010170 B 63217243 A 3871550 D1 3871550 T2 0280905 A2 9110061 B1 4802952 A	22-10-1996 31-01-1996 09-09-1988 09-07-1992 03-12-1992 07-09-1988 12-12-1991 07-02-1989
	US 5895233	A	20-04-1999	CA DE DE EP JP WO	2179052 A1 69409257 D1 69409257 T2 0734589 A1 9506712 T 9517014 A1	22-06-1995 30-04-1998 10-09-1998 02-10-1996 30-06-1997 22-06-1995